### (19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL<sup>6</sup>

### (12) 公開特許公報(A)

中内敷研発母

## (11)特許出願公開番号 特開平7-176255

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

**仕歩虫二体形** 

нотн	51/24 49/00	В	71 L100-5-10-13	r 1				<b>仅州</b> 农水值//
				審查請求	未請求	請求項の数5	OL	(全 11 頁)
(21)出願番号		特願平5-320525 平成5年(1993)12月	20日	(71) 出顧人	000004651 日本信号株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号			
				(71)出顧人	000167989			

ा च

(72)発明者 | 提田 規格 埼玉県浦和市上木崎1丁目13番8号 日本 信号株式会社与野事業所内 (72)発明者 江刺 正喜 宮城県仙台市太白区八木山南1-11-9

宫城県仙台市太白区八木山南1丁目11番地

江刺 正喜

(74)代理人 弁理士 笹島 富二雄

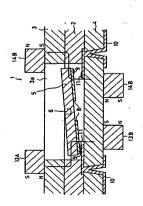
### (54) 【発明の名称】 ブレーナー型電磁リレー及びその製造方法

體別記号

### (57) 【要約】

【目的】電磁リレーの薄型化及び小型化を図ることを目 的とする。

【構成】シリコン基板 2 に、平板状の可動板 5 と該可動板 5 を揺動可能に軸支するトーションバー6 とを一体形成する。前記可動板 5 の上面周縁部に通電により磁界を発生する平面コイル7 を設け、下面側に可動接点 9 を設ける。 更に、シリコン基板 2 の上下面にガラス基板 3、4 を設け、下側ガス基板 3 には、前記可勤接点 9 と接回館な固定接点 1 1 を設ける。 更に、ガラス基板 3、4 の所定位置に、平面コイルに磁界を作用させる永久磁石 1 3 A、1 3 B 及び 1 4 A、1 4 B を固定する構成とする。また、この電磁リレーを半導体素子の製造プロセスによって製造する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板に、平板状の可動板と眩可動板 を半導体基板に対して基板上下方向に揺動可能に軸支す るトーションパーとを一体形成し、前記可動板の上面周 縁部に通電により磁界を発生する平面コイルを敷設する と共に下面側に可動接点部を設ける一方、半導体基板の 下面に前記可動板の接点部に対応する位置に固定接点部 を設けた下側給機基板を設け、半導体基板の上面には少 なくとも可動板上方を開放した上側絶線基板を設け、前 記トーションパーの軸方向と平行な可動板の対辺の平面 コイル部に磁界を作用させる互いに対をなす水入磁石を 的記上下絶線基板に固定する構成としたことを特徴とす るブレーナー型電磁リレー。

【請求項2】 半導体基板に、平板状の可動板と該可動板を半導体基板に対して基板上下方向に揺動可能に軸支するトーションパーとを一体形成し、前記可動板の上面周線部に永久碌石を設けると共に下面側に可動接点部を設ける一方、前記トーションパーの軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導体基板部分に、通電により破界を発生する平面コイルを設け、半導体基板の下面に前記可動板 20の接点部に対応する位置に固定接点部を設けた下側絶縁基板を設け、半導体基板の上側には少なくとも可動板上方を開放した上側絶縁基板を設ける構成としたことを特徴とするブレーナー型電磁リレー。

【請求項3】前記上側絶縁基板の開放部を開塞し、上下 絶縁基板と半導体基板とで囲まれる可動板収納空間を真 空状態とする構成とした請求項1又は2記載のプレーナ 一型電敵リレー。

【前東項 4】 半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて異方性エッチングより 30 貫通させて前記トーションバー部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形成する工程と、可動板上面 周囲版 電解めっきにより平面コイルを形成する工程と、同動板 下面に向記可動接点配を形成する工程と、同動線 基板の上面に前記可動接点に接離可能な固定接点部を形成する工程と、 成する工程と、半導体基板の上下面に楊極接合により下面総縁基板とを固定する工程と、上海体上板の上下面に楊極接合により下 面絶縁基板と少なくとも可動板上方部分を開放した上面 絶縁基板とを固定する工程と、トーションバー軸方向と 平行な可動板の対辺に対応する上面絶縁基板部分と下面 絶縁基板を形分に永久磁石を固定する工程とからなるプレ 40

【請求項5】半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて最为性エッチングより 買適させて前配トーションパー研分で半導体基板に揺動 可能に軸支される可動板を形成する工程と、可動板上面 周囲に薄膜の永久磁石を形成する工程と、可動板下面側 に可動接点部を形成する工程と、前配トーションパーの 軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導体基板部分に電 解めっきにより平面コイルを形成する工程と、下側絶縁 基板の上面に前記可動接点に接觸可能な固定接点部を形 50

成する工程と、半導体基板の上下面に陽極接合により下 面絶縁基板と少なくとも可動板上方部分を開放した上面 絶縁基板とを固定する工程とからなるブレーナー型電磁 リレーの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子製造技術を 用いて製造するプレーナー型電磁リレー及びその製造方 法に関する。

#### [00002]

【従来の技術】半導体デバイスの高集積化に代表されるマイクロエレクトロニクスの発展によって、様々な機構が高機能化と共に小型化している。産業用ロボットのような比較的大きなエネルギを扱う制御系もその例外ではない。このような制御系では制御装置のマイクロエレクトロニクス化によって、大きなエネルギの制御を非常に小さなエネルギで制御するようになっている。この結果、ノイズ等による観動作の問題が表面化し、最終及の出力デバイスとして電磁リレーの需要が増大している。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の電磁 リレーは半導体と比較すれば桁違いに大きな体積を占有 する。従って、機器の小型化を推進するためには、電磁 リレーの小型化が必要である。そして、従来の一般的な 巻線タイプの電磁リレーでは、長さ幅14mm,幅9m m,高さ5mmが世界最小である(「超薄型シグナルリ レー」,松下電工技報,No.35,pp27~31(1987年))参 照)。

【0004】また、最近では、更に電磁リレーの小型化を図るため、マイクロマシニング技術を用いたプレー型電磁リレーが提集されている(H. Mosaka, H. Kuwanー型電磁リレーが提集されている(H. Mosaka, H. Kuwan andK. K. Yanagi sawa "ELECTROMAGNETICMICRORELAYS: CONCEPS AND FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS"。Proc. IEEE MENS Workshop 93, pp. 12 ~17(1993)参照)。しかしながら、上記のプレーナー型電磁リレーも、コイルは従来の巻線型を用いており、小型化には限界がある。

【0005】本発明は上記の事情に鑑みなされたもので、電磁リレーのより一層の小型化を図ることを目的とする。

### [0006]

【課題を解決するための手段】このため、第1の発明のプレーナー型電盤リレーでは、半導体基板に、平板状の可動板と該可動板を半導体基板に対して基板上下方向に 相動可能に軸支するトーションパーとを一体形成し、前 配可動板の上面周縁部に通電により磁界を発生する平面 コイルを敷散すると共に下面側に可動接点部を設ける一方、半導体基板の下面に前記可動板の接点部に対応する位置に固定接点部を設けた「側路縁基板を設け、半導体基板の上面には少なくとも可動板上方を開放した上側絶線基板を設け、前記トーションパーの軸方向と平行な可

30

動板の対辺の平面コイル部に磁界を作用させる互いに対 をなす永久磁石を前記上下絶縁基板に固定する構成とし た。

【0007】また、第2の発明の電磁リレーでは、半導 体基板に、平板状の可動板と該可動板を半導体基板に対 して基板上下方向に揺動可能に軸支するトーションバー とを一体形成し、前記可動板の上面周縁部に永久磁石を 設けると共に下面側に可動接点部を設ける一方、前記ト ーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導 体基板部分に、通電により磁界を発生する平面コイルを 10 設け、半導体基板の下面に前記可動板の接点部に対応す る位置に固定接点部を設けた下側絶縁基板を設け、半導 体基板の上側には少なくとも可動板上方を開放した上側 絶縁基板を設ける構成とした。

【0008】また、前記上側絶縁基板の開放部を閉塞 し、上下絶縁基板と半導体基板とで囲まれる可動板収納 空間を真空状態とする構成とするとよい。第1の発明の 電磁リレーの製造方法としては、半導体基板のトーショ ンバー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて異 方性エッチングより貫通させて前記トーションバー部分 20 で半道体基板に採動可能に軸支される可動板を形成する 工程と、可動板上面周囲に電解めっきにより平面コイル を形成する工程と、可動板下面側に可動接点部を形成す る工程と、下側絶縁基板の上面に前記可動接点に接離可 能な固定接点部を形成する工程と、半導体基板の上下面 に陽極接合により下面絶縁基板と少なくとも可動板上方 部分を開放した上面絶縁基板とを固定する工程と、トー ションバー軸方向と平行な可動板の対辺に対応する上面 絶縁基板部分と下面絶縁基板部分に永久磁石を固定する 工程とからなることを特徴とする。

【0009】また、第2の発明の電磁リレーの製造方法 は、半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基板 の下面から上面に向けて異方性エッチングより貫通させ て前記トーションバー部分で半導体基板に揺動可能に軸 支される可動板を形成する工程と、可動板上面周囲に薄 膜の永久磁石を形成する工程と、可動板下面側に可動接 点部を形成する工程と、前記トーションバーの軸方向と 平行な可動板の対辺側方の半導体基板部分に電解めっき により平面コイルを形成する工程と、下側絶縁基板の上 面に前記可動接点に接離可能な固定接点部を形成する工 40 程と、半導体基板の上下面に陽極接合により下面絶縁基 板と少なくとも可動板上方部分を開放した上面絶縁基板 とを固定する工程とからなることを特徴とする。 [0010]

【作用】かかる構成によれば、半導体素子製造プロセス を利用して半導体基板に可動部を形成すると共に、可動 板に平面コイルを形成するようにしたので、コイル部分 を、薄型化及び小型化することができ、従来の巻線型に 比べて格段に電磁リレーの小型化を図ることができる。 【0011】更に、可動板の収納空間を真空封止するよ 50

うにすれば、可動板の揺動抵抗をなくすことができるよ うになり、電磁リレーの応答性を高めることができる。 [0012]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。図1~図4に第1の発明に係るプレーナー型電磁 リレーの第1実施例の構成を示す。図において、本実施 例の電磁リレー1は、半導体基板であるシリコン基板2 の上下面に、それぞれ例えばホウケイ酸ガラス等からな る上側及び下側絶縁基板としての上側及び下側ガラス基 板3、4を陽極接合した3層構造となっている。そし

て、前記上側ガラス基板3は、後述する可動板5上方部 分を開放するよう、例えば超音波加工等によって開口部 3 a が設けられている。 【0013】前記シリコン基板2には、平板状の可動板

5と、この可動板5の中心位置でシリコン基板2に対し て基板上下方向に揺動可能に可動板5を軸支するトーシ ョンパー6、6とが異方性エッチングによって一体形成 されている。従って、可動板5及びトーションバー6も シリコン基板と同一材料からなっている。前記可動板5 の上面周縁部には、図3に示すように、通電により磁界 を発生する銅薄膜からなる平面コイル 7 が絶縁被膜で覆 われて設けられている。ここで、コイルは抵抗分によっ てジュール熱損失があり抵抗の大きな薄膜コイルを高密 度に実装すると発熱により駆動力が制限されることか ら、本実施例では、従来公知の電解めっきによる電鉄コ イル法によって前記平面コイル7を形成してある。電鏡 コイル法は、基板上にスパッタで薄いニッケル層を形成 し、このニッケル層の上に銅電解めっきを行って銅層を 形成し、コイルに相当する部分を除いて銅層及びニッケ ル層を除去することで、銅層とニッケル層からなる薄膜 の平面コイルを形成するもので、薄膜コイルを低抵抗で 高密度に実装できる特徴があり、マイクロ磁気デバイス の小型化・薄型化に有効である。また、可動板5の下面 側の両側には、図4に示すように、コ字上の電気配線 8. 8が設けられ、これら各電気配線8. 8のそれぞれ の端部上面には、例えば金、白金等の可動接点9、9が 設けられている。

【0014】更に、下側ガラス基板4の上面には、電気 配線10,10が図3の二点鎖線で示すようなパターン で形成されており、この電気配線10、10上面の前記 可動接点9,9に対応する位置に、同じく金、白金等か らなる固定接点11,11が設けられている。前記電気 配線10,10は、図2に示すように、下側ガラス基板 4に設けた貫通穴部分を介して下側ガラス基板4の下面 側に引き出されている。

【0015】シリコン基板2のトーションバー6.6の 側方上面には、トーションバー6,6の部分を介して平 面コイル7と電気的に接続する一対の電極端子12.1 2が設けられており、この電極端子12, 12は、シリ コン基板2上に電鉄コイル法により平面コイル7と同時

(4)

形成される。上側及び下側ガラス基板3の図1中左右側には、前記トーションパー6,60軸方向と平行な可動板5の対辺の平面コイル7部分に磁界を作用させる互いに対をなす円形状の水外磁石13A,13Bと14A,14Bが設けられている。互いに対をなす一方の各3個づつの永久磁石13A,13Bは、図2に示すように、下側がN極、上側がS極となるよう設けられ、互いに対をなす他方の各3個づつの永久磁石14A,14Bは、図2に示すように、下側がS極、上側がN極となるよう設けられている。

【0016】次に動作を説明する。例えば、一方の電極 端子12を十極。他方の電極端子12を一極として平面 コイル7に電流を流す。可動板5の両側では、永久磁石 13Aと13B、14Aと14Bによって、図2の矢印で示すように上下の磁石間で可動板5の平面に沿つて平面コイル7を機切るような方向に磁界が形成されており、この磁界中の平面コイル7に電流が流れると、平面 コイル7の電流磁度と磁束密度に応じて平面コイル7、\*

ここで、Mx は振りモーメント、Gは横弾性係数、Ip は極断而二次モーメントである。また、L、I, r は、それぞれ、トーションパーの中心軸から力点までの 距離、トーションパーの長さ、トーションパーの半径で あり、図5に示してある。

【0019】そして、前記磁気カドとばね反カド/が的 り合う位置まで可動板5が回動する。従って、(3)式 のド'に(2)式のFを代入することにより、可動板5 の変位角もは平面コイルクに流れる電流iに比例することが判る。従って、可動板5下面の可動接点9,9が、トーションバー6のばね力に打ち勝って下側ガラス基板 34上面の固定接点11,11に圧接するのに充分な電流を平面コイル7に流せば、可動板5の回動で可動接点 9,9と固定接点11,11を接触させることができる。そして、平面コイル7に流す電流の方向切り換え 又は智能をON/OFFすることで、接点の切り換え又※

\* 言い検えれば可動板5の両端に、電流・磁束密度・力の フレミングの左手の法則に従った方向(図5に示す)に 磁気カドが作用し、この力はローレンツ力から求められ る。

[0017] この磁気力Fは、平面コイル7に流れる電 流密度をi、永久磁石13A, 13Bと14A, 14B による磁束密度をBとすると、下記の(1)式で求めら れる。

$$F = i \times B \cdot \cdot \cdot (1)$$

10 実際には、平面コイル7の巻数nと、磁気力Fが働くコイル長w(図5中に示す)により異なり、下記の(2)式のようになる。

 $\phi = (Mx / G I p) = (F' L / 8.5 \times 10^{\circ} r') \times 1. \cdots (3)$ 

※は電流の通電/遮断を制御することができる。

[0020] 次に、本実施例の電磁リレーにおける永久 磁石による磁束密度分布の計算結果について説明する。 図6は、本実施例に使用した円柱状の永久磁石の磁束密 度分布計算モデルを示し、永久磁石のN極とS極それぞ れの表面を微小領域切に分割し、求める点の磁束を計算 した。

【0021】N極表面で形成される磁束密度をBn、S 極表面で形成される磁束密度をBsとすると、これらは 円柱状の永久磁石による磁束密度分布の計算式から【数 1】、【数2】の各(4)、(5)式によって求めるこ とができ、任意の点における磁束密度Bは、BnとBs を合成したものになり、(6)式で示される。

【0022】 【数1】

... (5)

$$Bn = \frac{Br}{2\pi} \int_{-e/2}^{e/2} \frac{z \left[ (d/2)^2 - y^2 \right]^{1/2} dy}{\left[ (y-y_0)^2 + z^1 \right] \left[ (d/2)^2 + z^2 + y_0^2 - 2y_0 y \right]^{1/2}} \cdots (4)$$

[0023]

Bs = 
$$\frac{\text{[$\pm 2$]}}{2\pi} \int_{-\epsilon/\epsilon}^{\epsilon/\epsilon} \frac{(z+1)[(d/2)^2 - y^2]^{1/\epsilon} dy}{[(y-y_0)^2 + (z+1)^2][(d/2)^2 + (z+1)^2 + y_0^2 - 2y_0y]^{1/\epsilon}}$$

【0024】B=Bn+Bs・・・(6) 1mm, 高さ1 ここで、(数1)、(数2)の各式において、Brは永 外磁石の残留破束密度、x、y、zは永外磁石の周りの 曜子の表面に到 を関の任意の点を表す座標、1は永外磁石のN極面とS 磁石の表面に到 極面との距離、は各極面の半径である。例えば、半径 50 を図8に示す。

1 mm, 高さ 1 mm, 残留破束密度0.85TのSm-Co 永久磁石DIANET DM-18 (商品名、セイコー 電子部品製) を用いて、図7に示すように配置した永久 破石の表面に垂直な面 a の破束密度分布を計算した結果 を図8に示す。

【0025】図7のように配置した場合には、磁石間の 空間は、略0.3 丁以上の磁束密度となっている。次に、 可動板5の変位量の計算結果について説明する。可動板 5に形成する平面コイル7の幅を100μm、巻数を1 4、可動板5の厚さを20 umとし、トーションバー6 の半径を25 mm、長さを1 mm、可動板5の幅を4 m m、長さを5mmとして、(2)式と(3)式から求め た。尚、磁束密度は、前述の磁束密度分布計算で得られ た0.3 Tを使用した。

【0026】その結果、図9の(A)及び(B)図から 10 の(10)式で表される。 電流1.5 mAで2度の変位角が得られることがわかる。 尚、(C)は電流と発生する熱量Qとの関係を示すもの で、この時の単位面積当たりの発生熱量は13μワット /cm² となった。次に、発熱量と放熱の関係について競 明する。発熱量はコイルの抵抗で発生するジュール熱で あり、従って、単位時間当たりに発生する熱量のは下記 の(7)式によって表される。

[0027] Q=i2 R · · · (7)

ここで、iはコイルに流れる電流、Rはコイルの抵抗で ある。発熱量対流による放熱量Qc は下記の(8) 式で 20 表される.

 $Qc = hS\Delta T \cdot \cdot \cdot (8)$ 

ここで、hは熱伝達係数(空気は5×10<sup>-1</sup>~5×10 -\* 「ワット/cm\* ℃])、Sは素子の表面積、ΔTは素 子表面と空気との温度差である。

【0028】発熱部となる可動板の面積を20mm

<sup>2</sup> (4×5)とすると、(8)式は、 Qc =1.0 ΔT [mワット/℃] · · · (8) '

ここで、Eはシリコンのヤング率である。また、可動板 の重さfは下記の(12)式で表される。

 $f = W L_1 + \rho g \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$ 

ここで、 ρは可動板の体積密度、 g は重力加速度であ

【0033】また、可動板の撓み量∆Xは、同じく片持 ち梁の撓み量の計算方法を用いて、下記の (13) 式のよ うになる.

 $\Delta X = 4 (L_1/2)^3 F/EW t^3 \cdots$ 

ここで、Fは可動板の端に作用する磁気力である。そし て、前記磁気力Fは(2)式のコイル長wを可動板の長 40 さWと見做して求める。

【0034】これら、トーションバーの撓み量と可動板 の撓み量の計算結果を〔表1〕に示す。尚、可動板の撓 み量は、磁気力Fを30 u Nとして計算したものであ

[0035]

【表1】

\*となり、数十µワット/cm<sup>2</sup> 程度の発熱量ならば素子の 温度上昇の問題は無視できることがわかる。尚、参考す で、輻射による放勢量のrは下記の(9)式で表され

[0029] Qr =  $\epsilon$  S  $\sigma$  T' · · ·

ここで、 $\varepsilon$  は輻射率 (黒体は $\varepsilon = 1D$  一般に $\varepsilon <$ 1) 、Sは素子の表面積、σはステファンボルツマン定 数 (π²k¹/60h³c²)、Tは素子の表面温度である。ま た、トーションバーからの伝導による放熱量Qa は下記

[0030]

$$Qa = 2 \lambda (S/I_1) \Delta T \cdots (10)$$

ここで、λは熱伝導率(シリコンは84ワット/m K) 、Sはトーションバーの断面積、1, はトーション バーの長さ、ΔΤはトーションバーの両端の温度差であ る。トーションバーの半径を25μm、長さを1mmと すると (10) 式は、

Qa = 0.1  $\Delta$  T [m $\nabla v$   $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$ となる。

【0031】次にトーションバーの可動板自重による標 みと、電磁力による可動板の撓みについて説明する。図 10にこれらの計算モデルを示す。 トーションバーの長 さを1. 、トーションバーの幅をb、可動板の重さを f、可動板の厚さをt、可動板の幅をW、可動板の長さ をL. とすると、トーションバーの撓み量 A Yは、片持 ち梁の撓み量の計算方法を用いて、下記の(11)式のよ うになる。

[0032]

### トーションパーと可動板の梅み骨の計算結果

(11)

, .		1301 IV -> DC-> 7	T-ON SHARIN	
W	6 mm	6 mm	6 mm	
L,	13mm	18mm	13mm	
t	50 μ m	50 μ m	100 μ m	
b	50 μ m	50 µ m	50 μ m	
1,	0.5mm	1.0mm	1.0mm	
f	89 μ N	89 µ N	178 µ N	
ΔΥ	0. 022 μ m	0.178 µ m	0.356 μ m	
ΔX 0.125 μm		0. 125 μ m	0.016 μ m	

【0036】上記の〔表1〕から明らかなように、幅5 0 μm、長さ1.0 mmのトーションバーの場合、幅6 m m、長さ13mm、厚さ50μmの可動板による標み最 Δ Y は、0.178 μmであり、可動板の厚さを倍の100 umとしても、撓み量ΔYは、0.356 μmである。ま た、幅6mm、長さ13mm、厚さ50μmの可動板の 場合、磁気力による撓み量ΔXは、0.125 μmであり、 可動板両端の変位量を200μm程度とすれば、本実施 例の電磁リレーの特性には何ら影響はない。

50 【0037】以上説明したように、本実施例の電磁リレ

一では、コイルの発熱による影響も無視でき、また、可 動板5の揺動特性も何も問題になく、従来と同様の機能 を発揮することができる。そして、半導体素子の製造プ セスを利用して接点可動部やコイル等を形成すること によって、従来に比べて格段に超小型で薄型の電磁リレー とすることができる。このため、最終段の出力を電磁 リレーで制御する制御系システムの小型化を図ることが できる。また、半導体素子の製造プロセスで製造することで、大量生産が可能となる。

【0038】次に上記第1実施例の電磁リレーの製造工 10程を、図11~図14を参照したがら説明する。まず、図11及び図12にシリコン基板の加工工程を示す。厚 5300 μ mのシリコン基板101の上下面を熱酸化して酸化限(1μm)102を形成する(a工程)。

【0039】次に、裏面側にホトリングラフにより貫通 穴のパターンを形成し、貫通穴部分の酸化膜をエッチン 分除去し(b工程)、更に、可動板形成部の酸化膜を厚 50.5 μmまで除去する(工程e)。次に、表面側にワ ックス層103 を設けた後、貫通穴部分に異方性エッチン グを100 μm行う(工程d)。

[0040] 裏面側の可動板部分の薄い酸化膜を除去し (工程ε)、貫通穴と可動板部分に異方性エッチングを 100μm行う(工程f)。次に、貫通穴部分で囲まれた 可動板裏面に相当するシリコン基板部分に、電気配線部 分を残してマスクし、例えばニッケル或いは鯛のスパッ タを行ってコ字状の電気配線8,8を形成し、更に、可 動様点部分を除いてマスクし、金或いは白金の層を例え ば蒸着等によって形成し可動様点9,9を形成する(工 程度)。

【0041】次に、表面側のワックス層103を除去し、 表面側の酸化膜102 上に、従来公知の電鋳コイル法によ って平面コイル、電極端子部(図示せず)を形成する。 電鋳コイル法は、シリコン基板101 の表面側にニッケル のスパッタを行ってニッケル層を形成し、銅電解めっき を行って銅層を形成する。次にポジ型のレジストで平面 コイル及び電極端子に相当する部分をマスクし、銅エッ チング、ニッケルエッチングを順次行い、エッチング 後、レジストを除去し、更に、銅電解めっきを行ってニ ッケル層の全周を銅で覆い平面コイル及び電極端子に相 当する銅層を形成する。次に、銅層を除いた部分にネガ 40 型のメッキレジストを塗布した後、銅電解めっきを行っ て銅層を厚くして、平面コイル及び電極端子を形成す る。そして、平面コイル部分を例えば感光性ポリイミド 等の絶縁層で覆う。平面コイルを2層にする場合は、再 度ニッケルのスパッタ工程から絶縁層形成までの工程を 繰り返し行えばよい(工程h)。

【0042】次に、表面側にワックス層103′を設け、 可動板裏面部分をマスクした後、貫通穴部分に異力性エ ッチングを100 μm行い、貫通穴部分を貫通させ、可動 舷部分を除いてワックス層103′を除去する。この際 に、上下の酸化膜102 も除去する。これにより、可動板 5とトーションバー (図示せず) が形成され、図1のシ リコン基板2が形成される(工程i,j)。

【0043】以上で、シリコン基板2の可動板5及びトーションバーが一体に形成される。その後、可動板部分のワックス層を除去した後、シリコン基板2の上下面に上側ガラス基板3と下側ガラス基板4をそれぞれ場極接合によって結合し、上下のガラス基板3、4の所定位置に水久破石10A、10Bと11A、11Bを取付ければよい、

【0044】次に、図13及び図14を参照しながら上下ガラス基板の加工工程を説明する。まず、上側ガラス 基板3は、例えば超音波加工により可動板上方部分に相 当する位置に穴を開け、開口部3aを形成すればよい (工程a)。一方、「側ガラス基板4では、まず、電解 放電加工によってスルーホール用の資通穴4a、4aを

ガラス基板 4 の裏面側から形成する(工程 b)。 【0045】そして、下側ガラス基板 4 の両面に、例え ば、ニッケル成いは鯛のスパッタを行い、金属圏 104 を 形成する(工程 c)。次に、貫通穴 4 a を含む電気配線 部分をマスクし、その他の部分をエッチングして金属圏 104 を除去することで、電気配線 1 0, 1 0 を形成する (工程 d)。次に、ガラス基板 4 の表面側にリフトオフ 用に、ホトリングラフにより固定接点のパターンを形成 して固定接点部を除いてレジスト105 を塗布する(工程 c)。

【0046】 於に、ガラス基板4表面側の全面に金成い は白金の蒸着により蒸着層100を形成する(工程 f)。 於に、レジストを除去することで、固定接点部を除く他 30 の部分の蒸着層106を除去し、固定接点11,11を形 成する(工程 g)。 次に第10発明に係る電磁リレーの 第2実施例を図15に示す。尚、第1実施例と同一要素 には同一符号を付して説明を省略する。

【0047】図において、本実施例の電磁リレー21 は、シリコン基板2及び下側ガラス基板4の構成は、第 1実施例と同様であるが、上側ガラス基板3′の構成が 異なる。即ち、上側ガラス基板3′は、第1実施例の上 側ガラス基板3の開口部3aに相当する部分を、放電加 工等によって構3A′として開塞する構成としてある。 そして、シリコン基板2の上下面に、上側ガラス基板 3′と下側ガラス基板4をѨ極接合によって結合して、

3<sup>1</sup> と下側ガラス基板4を陽極接合によって結合して、 可動板5の揺動空間を密閉する構成としている。更に、 この密閉空間を真空雰囲気にして電磁リレー21を駆動 させる。

【0048】かかる構成によれば、可動板5が回動する 際の空気抵抗がなくなるため、可動板の応答性を向上で きる。そして、シリコン基板2に上下のガラス基板 3′,4を結合する際に、接着剤を用いるとガスが可動 板の揺動空間に侵入する虞れがあるが、本実施例のよう に 陽極接合を用いればその心配はない。また、可動板 5 の揺動空間を真空封止する際に、空間内に硫化フッ素 (SF。) を封入することで、絶縁耐圧が向上する。

【0049】次に、図16に第2の発明に係る電磁リレ 一の実施例を示し説明する。尚、上記の各実施例と同一 要素には同一符号を付して説明を省略する。図16にお いて、本実施例の電磁リレー31では、可動板5側に 平面コイルに代えて薄膜の永久磁石32を設ける。-方、シリコン基板2のトーションバー6、6の動方向と 平行な可動板5の対辺側方の部分に、通電により磁界を 発生する平面コイル7A、7Bを設ける。また、上側ガ 10 ラス基板3'は、図15に示すものと同様で溝3A'を 有し閉塞された構成である。尚、本実施例では枠状に永 久磁石を設けたが、平面コイルと対応する辺だけに永久 磁石を設けるようにしてもよい。

【0050】かかる構成のように、薄膜の永久磁石32 を可動板5側に設け、平面コイル7A、7Bをシリコン 基板2側に設けるようにしても、上述の各実施例と同様 に動作させることができる。更に、可動板5側にコイル を設けていないので、発熱に関する問題は生じない。ま た、薄膜の磁石を用いているので、可動板5の動作が鉢 20 くなると言うことはなく、可動板5だけの封止も可能で ある。そして、可動板5の揺動空間を真空封止すれば、 図15に示す実施例と同様で可動板5の応答性が良好と なる。

### [0051]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、コ イルを従来の巻線型ではなく半導体素子製造技術を用い て形成する構成としたので、従来の巻線型コイルを用い る電磁リレーに比較して格段に小型化及び薄型化するこ とができる。従って、電磁リレーを使用する制御系のシ 30 ステムの集積化及び小型化を図ることができる。

【0052】また、可動板の揺動空間を密閉空間として 真空封止する構成とすれば、空気抵抗をなくすことがで き、可動板の応答性を向上でき、リレー応答性を高める ことができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1の本発明に係る電磁リレーの第1実施例を\*

\* 示す構成図

【図2】同上第1 実施例の拡大縦断面図

【図3】同上第1実施例の可動板の上面側の拡大斜視図

【図4】同上第1実施例の可動板の下面側の拡大斜視図

12

【図5】同上第1実施例のガルバノミラーの動作原理を 説明する図

【図6】同上第1実施例の永久磁石による磁束密度分布 の計算モデル図

【図7】計算した磁束密度分布位置を示す図

【図8】図7に示す位置の磁束密度分布の計算結果を示 す図

【図9】 可動板の変位量と電流量との計算結果を示すグ

【図10】トーションバー及び可動板の標み最の計算モ

【図11】同上第1実施例のシリコン基板の加工工程の 説明図

【図12】図11に続くシリコン基板の加工工程の説明

【図13】同上第1実施例のガラス基板の加工工程の説

【図14】図13に続くガラス基板の加工工程の説明図 【図15】第1の発明に係る電磁リレーの第2実施例の

構成を示す斜視図 【図16】第2の発明に係る餌磁リレーの実施例の構成 を示す斜視図

【符号の説明】

電磁リレー 1, 21, 31

シリコン基板

3, 3' 上側ガラス基板

下側ガラス基板

可動板 6 トーションバー

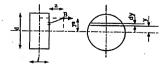
平面コイル

可動接点

5

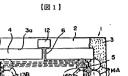
11 固定接点 13A, 13B, 14A, 14B, 32

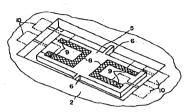
[図6]



[図7]

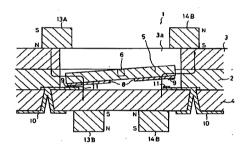


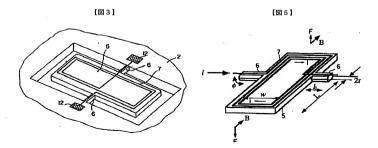




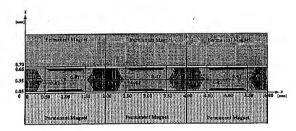
[図4]

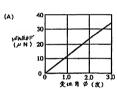
[図2]



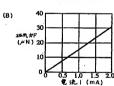


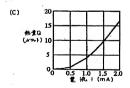
【図8】

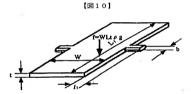


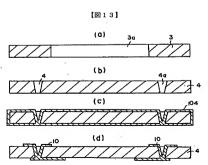


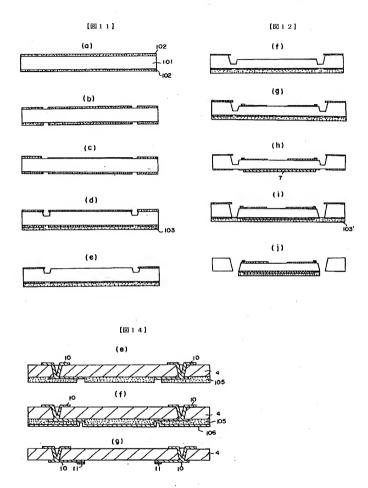
[図9]

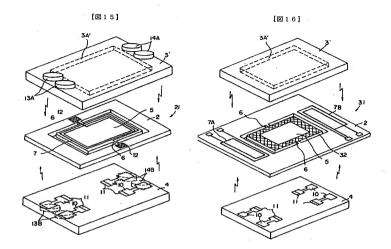












【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成13年2月23日(2001.2.23)

【公開番号】特開平7-176255

【公開日】平成7年7月14日(1995.7.14)

【年通号数】公開特許公報7-1763

【出願番号】特願平5-320525

【国際特許分類第7版】

H01H 51/24

49/00

[FI]

H01H 51/24 B 49/00 J

### 【手続補正書】

【提出日】平成12年5月30日(2000.5.3 0)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板に、平板状の可動板と該可動板 を半導体基板に対して揺動可能に触支するトーションパーとを一体形成し、前記可動板の固縁節に通電により磁 界を発生する平面コイルを敷設すると共に可動板点部を 設ける一方、前記可動板の可動接点部に接離可能な固定 接点部を設け、前記トーションパーの軸方向と平行な可 動板の対辺の平面コイル部に<u>静磁界を与える磁界発生手</u> 段を備える構成としたことを特徴とするプレーナー型電 載りレー。

【請求項2】 前記磁界発生手段は、前記トーションバー の軸方向と平行な可動板の対辺の平面コイル部のみに静 破界を与える構成である請求項1に記載のプレーナー型 電磁リレー。

【請求項3】前配礎界発生手段は、前記可動板に対して 上下に配置して、前記可動板平面に沿う静磁界を発生さ せる構成とした請求項1又は2に配載のブレーナー型電 磁リレー。

【請求項4】 前配磁界発生手段は、前配可動板に対して 上下に配置し、且つ位置をすらして、前配可動板平面に 治う静磁界を発生させる構成とした請求項1又は2に配 載のプレーナー型電磁リレー。

【請求項5】 <u>生源体基板の上下面に上側基板と下側基板を設け、上側及び下側の基板にそれぞれ前距磁界発生手</u> <u>を設け、上側及び下側の基板にそれぞれ前距磁界発生手</u> <u>をを固定する構成とした請求項3又は4に記載のプレーナー型電磁リレー。</u>

【請求項6】前配磁界発生手段は、永久磁石である請求

項1~5のいずれか1つに記載のブレーナー型電磁リレ

【請求項7】半導体基板に、平板状の可動板と眩可動板を半導体基板に対して揺動可能に軸支するトーションパーとを一体形成し、前記可動板の固縁配に盛芽発生手段を設けると共に可動接点部を設ける一方、前記トーションパーの軸方向と平行な可動板の対迎側方の半導体基板部分に、通電により磁界を発生する平面コイルを設け、前記可動板の可動接点部に接触可能な固定接点部を設ける構成としたことを特徴とするプレーナー型電磁リレ

【請求項8】<u>前記磁界発生手段は、薄膜の永久磁石であ</u>る請求項7に記載のプレーナー型電磁リ<u>レー。</u>

【請求項9】<u>半導体基板の上下面に上側基板と下側基板を設ける構成とした請求項7又は8</u>に記載のプレーナー 型電磁リレー。

【請求項10】<u>前記上側基板と下側基板で可動板収納空間を閉塞し、この可動板収納空間を真空状態とする構成とした請求項5又は9に記載のプレーナー型電磁リレ</u>

【請求項11】<u>前記上側基板及び下側基板が、絶縁基板である請求項10に記載のプレーナー型電磁リレー。</u>

【請求項12】半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて貫通させて前記トーションバー部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形成する工程と、可動板固肥に平面コイルを形成する工程と、可動板に可動接点部を形成する工程と、直の動接点に接離可能な固定接点部を形成する工程と、上ーションバー軸方向と平行な可動板の対辺に対応する位置に磁界発生手段を固定する工程とからなるプレーナー型電磁リレーの製造方法。

【請求項13】<u>前記磁界発生手段を固定する工程は、磁界発生手段を、可動板に対して上下に配置して、可動板</u>平面に沿う静磁界を発生させるように固定する請求項1

2に記載のプレーナー型電磁リレーの製造方法。

【請来項14】的記磁界発生手段を固定する工程は、磁 界発生手段を、可動板に対して上下に配置し、且つ位置 をずらして、可動板平面に沿う静磁界を発生させるよう に固定する請求項12に記載のプレーナー型電磁リレー の製造方法。

【前来項15】半導体基板のトーションパー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて貫通させて前記トーションパー部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形成する工程と、可動板<u>回囲に健果発生手段</u>を形成する工程と、可動板<u>回間に健果発生手段</u>を形成する工程と、可動板上可動接点部を形成する工程と、前記トーションパーの軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導体基板部分上平面コイルを形成する工程と、直記可動接点に接触可能な固定接点部を形成する工程とからなるプレーナー型電磁リレーの刺音方法。

【請求項16】前記可動板形成工程は、異方性エッチングを用いる請求項12~15のいずれか1つに記載のプレーナー型電磁リレーの製造方法。

[請來項17] 前記平面コイル形成工程は、整解めっき により平面コイルを形成する請求項12~16のいずれ か1つに記載のプレーナー型電磁リレーの製造方法。 【請來項18] 半導体基板の上下面に上側基板と下側基 板2を固定する工程を有する請求項12~17のいずれ か1つに記載のプレーナー型電磁リレーの製造方法。

【請求項19】前記上側及び下側基板の固定工程は、腸 極接合を用いて行う請求項18に記載のプレーナー型電 磁リレーの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の電磁 リレーは半導体と比較すれば桁違いに大きな体積を占有 する。従って、機器の小型化を推進するためには、電磁 リレーの小型化が必要である。そして、従来の一般的な 巻線タイプの電磁リレーでは、長き14mm,幅9m m,高さ5mmが世界最小である(「超減型シグナルリ レー」、松下電工技報、No.35, pp27 ~31 (1987年)参 (1)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

[0006]

【課題を解決するための手段】このため、第1の発明の プレーナー型電磁リレーでは、半導体基板に、平板状の 可動板と該可動板を半導体基板に対して揺動可能に軸支 するトーションバーとを一体形成し、前記可動板の<u>周縁</u> 館に通電により磁界を発生する平面コイルを敷設すると 共<u>に可動様点部を設ける一方。前記可動板の可動接点部 に接離可能な固定接点部を設け、前</u>記トーションバーの 輸力向と平行な可動板の対辺の平面コイル部に<u>静磁界を</u> 与える磁界発生手段を備える構成とした。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】前記磁界発生手段は、前記トーションバー の軸方向と平行な可動板の対辺の平面コイル部のみに静 磁界を与える構成とするとよい。具体的には、磁界発生 手段を、前配可動板に対して上下に配置する。更には、 磁界発生手段を、前記可動板に対して上下に配置し、且 つ位置をずらして、前記可動板平面に沿う静磁界を発生 させるようにするとよい。このような場合、半導体基板 の上下面に上側基板と下側基板を設け、上側及び下側の 基板にそれぞれ前記磁界発生手段を固定する構成とする とよい。前記磁界発生手段は、永久磁石とする。また、 第2の発明の電磁リレーでは、半導体基板に、平板状の 可動板と該可動板を半導体基板に対して揺動可能に軸支 するトーションバーとを一体形成し、前記可動板の<u>周縁</u> 部に磁界発生手段を設けると共に可動接点部を設ける一 方、前記トーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺 側方の半導体基板部分に、通電により磁界を発生する平 面コイルを設け、前記可動板の可動接点部に接離可能な 固定接点部を設ける構成とした。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】前記磁界発生手段は、薄膜の永久磁石とす る。また、半導体基板の上下面に上側基板と下側基板を 設ける構成とした。更に、前記上側基板と下側基板で可 動板収納空間を閉塞し、この可動板収納空間を真空状態 とするとよい。前記上側基板及び下側基板を、絶縁基板 とするとよい。\_第1の発明の電磁リレーの製造方法とし ては、半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基 板の下面から上面に向けて貫通させて前記トーションバ 一部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形 成する工程と、可動板周囲に平面コイルを形成する工程 と、可動板に可動接点部を形成する工程と、前記可動接 点に接離可能な固定接点部を形成する工程と、トーショ ンパー軸方向と平行な可動板の対辺に対応する位置に磁 界発生手段を固定する工程とからなることを特徴とす る。また、前記磁界発生手段を固定する工程は、磁界発 生手段を、可動板に対して上下に配置して、可動板平面 に沿う静磁界を発生させるように固定するとよく。 更 に、磁界発生手段を、可動板に対して上下に配置し、目 つ位置をずらして、可動板平面に沿う静磁界を発生させ るように固定するとよい。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】 変更

【補正内容】

【0009】また、第2の発明の電磁リレーの製造方法 は、半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基板 の下面から上面に向けて貫通させて前記トーションバー 部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形成 する工程と、可動板周囲に磁界発生手段を形成する工程 と、可動板に可動接点部を形成する工程と、前記トーシ ョンバーの軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導体基 板部分に平面コイルを形成する工程と、前記可動接点に 接離可能な固定接点部を形成する工程とからなることを 特徴とする。前記可動板形成工程は、異方性エッチング を用いるとよい。また、前記平面コイル形成工程は、電 解めっきにより平面コイルを形成するとよい。また、半 導体基板の上下面に上側基板と下側基板とを固定する工 程を有する。この上側及び下側基板の固定工程は、陽極 接合を用いて行うとよい。

【手統補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】前記シリコン基板2には、平板状の可動板 5と、この可動板5の中心位置でシリコン基板2に対し て基板上下方向に揺動可能に可動板5を軸支するトーシ ョンバー6.6とが異方性エッチングによって一体形成 されている。従って、可動板5及びトーションバー6も シリコン基板と同一材料からなっている。前記可動板5 の上面周縁部には、図3に示すように、通電により磁界 を発生する銅薄膜からなる平面コイル7が絶縁被膜で覆 われて設けられている。ここで、コイルは抵抗分によっ てジュール熱損失があり抵抗の大きな薄膜コイルを高密 度に実装すると発熱により駆動力が制限されることか ち、本実施例では、従来公知の電解めっきによる電鋳コ イル法によって前記平面コイル7を形成してある。電鏡 コイル法は、基板上にスパッタで薄いニッケル層を形成 し、このニッケル層の上に銅電解めっきを行って銅層を 形成し、コイルに相当する部分を除いて銅層及びニッケ ル層を除去することで、銅層とニッケル層からなる薄膜 の平面コイルを形成するもので、薄膜コイルを低抵抗で 高密度に実装できる特徴があり、マイクロ磁気デバイス の小型化・薄型化に有効である。また、可動板5の下面 側の両側には、図4に示すように、コ字状の電気配線

8. 8が設けられ、これら各電気配線 8. 8のそれぞれ の端部上面には、例えば金、白金等の可動接点9、9が 設けられている。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】更に、下側ガラス基板4の上面には、電気 配線10.10が図4の二点鎖線で示すようなパターン で形成されており、この電気配線10,10上面の前記 可動接点9.9に対応する位置に、同じく金、白金等か らなる固定接点11、11が設けられている。前記電気 配線10.10は、図2に示すように、下側ガラス基板 4 に設けた貫通穴部分を介して下側ガラス基板 4 の下面 側に引き出されている

【手總補正9】

【補正対象審類名】 明細書

【補正対象項目名】 0015 【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】シリコン基板2のトーションバー6、6の 側方上面には、トーションバー6,6の部分を介して平 面コイル7と電気的に接続する一対の電極端子12,1 2が設けられており、この電極端子12, 12は、シリ コン基板2上に電鋳コイル法により平面コイル7と同時 形成される。上側及び下側ガラス基板3,4の図1中左 右側には、前記トーションバー6,6の軸方向と平行な 可動板5の対辺の平面コイル7部分に磁界を作用させる 互いに対をなす円形状の永久磁石13A, 13Bと14 A. 14Bが設けられている。互いに対をなす一方の各 3個づつの永久磁石13A, 13Bは、図2に示すよう に、下側がN極、上側がS極となるよう散けられ、互い に対をなす他方の各3個づつの永久磁石14A, 14B は、図2に示すように、下側がS極、上側がN極となる よう設けられている。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

 $[0\ 0\ 2\ 9]\ Qr = S \sigma T' \cdot \cdot \cdot (9)$ 

ここで、 $\epsilon$ は輻射率(黒体は $\epsilon = 1$ で一般には $\epsilon$  < 1) 、Sは素子の表面積、σはステファンボルツマン定 数 (π²k¹/60h³c²)、Τは索子の表面温度である。ま た、トーションバーからの伝導による放熱量Qa は下記 の (10) 式で表される。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

##《補正対象項目名》0043

### 【補正方法】変更

### 【補正内容】

[0043] 以上で、シリコン基板2に可動板5及びトーションパーが一体に形成される。その後、可動板部分のワックス層を除去した後、シリコン基板2の上下面に上側ガラス基板3と下側ガラス基板4をそれぞれ腸極接合によって結合し、上下のガラス基板3、4の所定位置に永久磁石13A、13Bと14A、14Bを取付ければよい。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正内容】

【図5】同上第1実施例の<u>電磁リレー</u>の動作原理を説明

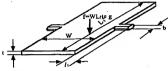
する図

【手続補正13】

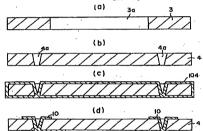
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図10 【補正方法】変更 【補正内容】

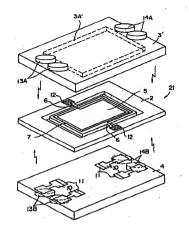
【図10】



【手続補正14】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図13 【補正方法】変更 【補正内容】 【図13】



[手続補正15] [補正対象費類名] 図面 [補正対象項目名] 図15 [補正方法] 変更 [補正内容] [図15]



### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-176255

(43) Date of publication of application: 14.07.1995

(51)Int.Cl.

H01H 51/24 H01H 49/00

(21)Application number: 05-320525

(71)Applicant: NIPPON SIGNAL CO LTD:THE **FSASHI MASAKI** 

(22)Date of filing:

20.12 1993

(72)Inventor: ASADA NORIHIRO

ESASHI MASAKI

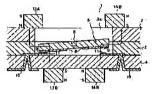
# (54) PLANER ELECTROMAGNETIC RELAY AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To attain thinning and miniaturization of an

electromagnetic relay. CONSTITUTION: On a silicon substrate 2, a flat plateshaped movable plate 5 and a torsion bar 6 of swivelably journalling the movable plate 5 are integrally formed. A flat coil 7 for generating a magnetic field by carrying a current is provided in an upper surface peripheral edge part of the movable plate 5, and a movable contact 9 is provided in a lower surface side. Further, glass substrates 3, 4 are provided in upper/lower surfaces of the silicon substrate 2, and fixed contact 11 capable of coming into contact with the movable contact 9 is provided in the lower side glass substrate 3. Further in this constitution, permanent magnets 13A, 13B and 14A, 14B for making a magnetic field act in the plane coil are fixed to a prescribed position of the glass substrates 3. 4. This electromagnetic relay is manufactured by a

process of manufacturing a semiconductor element.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of

11.03.2003

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3465940 29.08.2003

[Number of appeal against examiner's decision 2003-006003

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

10.04.2003

decision of rejection]
[Date of extinction of right]
\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### CLAIMS

### [Claim(s)]

[Claim 1] The torsion bar spring which supports a plate-like movable plate and this plate-like movable plate to revolve rockable in the substrate vertical direction to a semi-conductor substrate to a semi-conductor substrate is really formed. While laying the flat-surface coil which generates a field by energization in the top-face periphery section of said movable plate and preparing the traveling contact section in an inferior-surface-of-tongue side The bottom insulating substrate which prepared the fixed contact surface in the location corresponding to the contact surface of said movable plate is prepared in the inferior surface of tongue of a semi-conductor substrate. The top insulating substrate which opened the movable-plate upper part wide at least is prepared in the top face of a semi-conductor substrate. The planar mold electromagnetic relay characterized by considering as the configuration which fixes to said vertical insulating substrate the permanent magnet which makes a field act on the flat-surface coil section of the opposite side of a movable plate parallel to the shaft orientations of said torsion bar spring, and which makes a pair mutually.

[Claim 2] The torsion bar spring which supports a plate-like movable plate and this plate-like movable plate to revolve rockable in the substrate vertical direction to a semi-conductor substrate to a semi-conductor substrate is really formed. While preparing a permanent magnet in the top-face periphery section of said movable plate and preparing the traveling contact section in an inferior-surface-of-tongue side Into the semi-conductor substrate part of the opposite side side of a movable plate parallel to the shaft orientations of said torsion bar spring Prepare the flat-surface coil which generates a field by energization, and the bottom insulating substrate which prepared the fixed contact surface in the location corresponding to the contact surface of said movable plate is prepared in the inferior surface of tongue of a semi-conductor substrate. The planar mold electromagnetic relay characterized by considering as the configuration which prepares the top insulating substrate which opened the movable-plate upper part wide at least in the semi-conductor substrate bottom.

[Claim 3] The planar mold electromagnetic relay according to claim 1 or 2 considered as the configuration which makes a vacua movable-plate storage space which blockades the open section of said top insulating substrate, and is surrounded with a vertical insulating substrate and a semi-conductor substrate.

[Claim 4] The process which forms the movable plate which is made to penetrate from anisotropic etching towards a top face, and is supported to revolve with said torsion-bar-spring part by the semi-conductor substrate rockable from the inferior surface of tongue of a substrate except for the torsion-bar-spring formation part of a semi-conductor substrate, The process which forms a flat-surface coil in the perimeter of a movable-plate top face with electrolysis plating, and the process which forms the traveling contact section in a movable-plate inferior-surface-of-tongue side, The process which forms in the top face of a bottom insulating substrate the fixed contact surface which can attach and detach to said traveling contact. The process which fixes to the vertical side of a semi-conductor substrate an inferior-surface-of-

tongue insulating substrate and the top-face insulating substrate which opened the movableplate upper part wide at least by anode plate junction. The manufacture approach of a planar mold electromagnetic relay which consists of a process which fixes a permanent magnet to the top-face insulating-substrate part and inferior-surface-of-tongue insulating-substrate part corresponding to the opposite side of a movable plate parallel to torsion-bar-spring shaft orientations.

[Claim 5] The process which forms the movable plate which is made to penetrate from anisotropic etching towards a top face, and is supported to revolve with said torsion-bar-spring part by the semi-conductor substrate rockable from the inferior surface of tongue of a substrate except for the torsion-bar-spring formation part of a semi-conductor substrate, The process which forms the permanent magnet of a thin film in the perimeter of a movable-plate top face, and the process which forms the traveling contact section in a movable-plate inferior-surface-of-tongue side, The process which forms a flat-surface coil in the semi-conductor substrate part of the opposite side side of a movable plate parallel to the shaft orientations of said torsion bar spring with electrolysis plating. The manufacture approach of a planar mold electromagnetic relay which consists of a process which fixes an inferior-surface-of-tongue insulating substrate and the top-face insulating substrate which opened the movable-plate upper part part wide at least to the process which forms in the top face of a bottom insulating substrate the fixed contact surface which can attach and detach to said traveling contact, and the vertical side of a semi-conductor substrate by anode plate junction.

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to the planar mold electromagnetic relay manufactured using a semiconductor device manufacturing technology, and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] By development of the microelectronics represented by high integration of a semiconductor device, various devices are miniaturized with advanced features. The control system treating comparatively big energy like an industrial robot is not the exception, either. At such a control system, control of big energy is controlled by microelectronics-ization of a control unit with very small energy. Consequently, the problem of malfunction by a noise etc. surfaces and the need of an electromagnetic relay is growing as an output device of the last stage.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, the conventional electromagnetic relay occupies the extraordinarily big volume, if it compares with a semi-conductor. Therefore, in order to promote the miniaturization of a device, the miniaturization of an electromagnetic relay is

required. And reference die-length width of face of 14mm, width of face of 9mm, and whose height of 5mm are the smallest in the world in an electromagnetic relay common coil type [conventional] ("a super-thin signal relay", the Matsushita Electric Works technical report, No.35, and pp 27-31) (1987).

[0004] Moreover, recently, in order to attain the miniaturization of an electromagnetic relay further, the planar mold electromagnetic relay using a micro-machining technique is proposed (H. Hosaka, H.Kuwano andK.KYanagisawa"ELECTROMAGNETICMICRORELAYS:CONCEPS AND FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS", Proc.IEEE MENS Workshop 93, pp.12 – 17 (1993) reference). However, the above-mentioned planar mold electromagnetic relay also uses the coil mold of the former [ coil ], and there is a limitation in a miniaturization.

[0005] This invention was made in view of the above-mentioned situation, and aims at attaining much more miniaturization of an electromagnetic relay.

### [0006]

[Means for Solving the Problem] for this reason, in the planar mold electromagnetic relay of the 1st invention The torsion bar spring which supports a plate-like movable plate and this plate-like movable plate to revolve rockable in the substrate vertical direction to a semi-conductor substrate to a semi-conductor substrate is really formed. While laying the flat-surface coil which generates a field by energization in the top-face periphery section of said movable plate and preparing the traveling contact section in an inferior-surface-of-tongue side The bottom insulating substrate which prepared the fixed contact surface in the location corresponding to the contact surface of said movable plate is prepared in the inferior surface of tongue of a semi-conductor substrate. The top insulating substrate which opened the movable-plate upper part wide at least was prepared in the top face of a semi-conductor substrate, and it considered as the configuration which fixes to said vertical insulating substrate the permanent magnet which makes a field act on the flat-surface coil section of the opposite side of a movable plate parallel to the shaft orientations of said torsion bar spring, and which makes a pair mutually.

[0007] Moreover, the torsion bar spring which supports a plate-like movable plate and this plate-like movable plate to revolve with the electromagnetic relay of the 2nd invention rockable in the substrate vertical direction to a semi-conductor substrate to a semi-conductor substrate is really formed. While preparing a permanent magnet in the top-face periphery section of said movable plate and preparing the traveling contact section in an inferior-surface-of-tongue side Into the semi-conductor substrate part of the opposite side side of a movable plate parallel to the shaft orientations of said torsion bar spring The flat-surface coil which generates a field by energization was prepared, the bottom insulating substrate which prepared the fixed contact surface in the location corresponding to the contact surface of said movable plate was prepared in the inferior surface of tongue of a semi-conductor substrate, and it considered as the configuration which prepares the top insulating substrate which opened the movable-plate upper part wide at least in the semi-conductor substrate bottom.

[0008] Moreover, it is good to consider as the configuration which makes a vacua movable-plate storage space which blockades the open section of said top insulating substrate, and is surrounded with a vertical insulating substrate and a semi-conductor substrate. As the manufacture approach of the electromagnetic relay the 1st invention The process which forms the movable plate which is made to penetrate from anisotropic etching towards a top face, and is supported to revolve with said torsion-bar-spring part by the semi-conductor substrate rockable from the inferior surface of tongue of a substrate except for the torsion-bar-spring formation part of a semi-conductor substrate. The process which forms a flat-surface coil in the perimeter of a movable-plate top face with electrolysis plating, and the process which forms the traveling contact section in a movable-plate inferior-surface-of-tongue side. The process which forms in the top face of a bottom insulating substrate the fixed contact surface which can attach and detach to said traveling contact, The process which fixes to the vertical side of a semiconductor substrate an inferior-surface-of-tongue insulating substrate and the top-face insulating substrate which opened the movable-plate upper part part wide at least by anode plate junction. It is characterized by consisting of a process which fixes a permanent magnet to the top-face insulating-substrate part and inferior-surface-of-tongue insulating-substrate part

corresponding to the opposite side of a movable plate parallel to torsion-bar-spring shaft orientations.

[0009] Moreover, the manufacture approach of the electromagnetic relay the 2nd invention The process which forms the movable plate which is made to penetrate from anisotropic etching towards a top face, and is supported to revolve with said torsion-bar-spring part by the semiconductor substrate rockable from the inferior surface of tongue of a substrate except for the torsion-bar-spring formation part of a semi-conductor substrate, The process which forms the permanent magnet of a thin film in the perimeter of a movable-plate top face, and the process which forms the traveling contact section in a movable-plate inferior-surface-of-tongue side, The process which forms a flat-surface coil in the semi-conductor substrate part of the opposite side of a movable plate parallel to the shaft orientations of said torsion bar spring with electrolysis plating, It is characterized by consisting of a process which fixes an inferior-surface-of-tongue insulating substrate and the top-face insulating substrate which opened the movable-plate upper part part wide at least to the process which forms in the top face of a bottom insulating substrate the fixed contact surface which can attach and detach to said traveling contact, and the vertical side of a semi-conductor substrate by anode plate junction. [0010]

[Function] since according to this configuration the flat-surface coil was formed in the movable plate while forming moving part in the semi-conductor substrate using the semiconductor device manufacture process — a coil part — thin-shape—izing — and it can miniaturize, and can be markedly alike compared with the conventional coil mold, and the miniaturization of an electromagnetic relay can be attained.

[0011] Furthermore, if it is made to carry out the vacuum lock of the storage space of a movable plate, rocking resistance of a movable plate can be lost now and the responsibility of an electromagnetic relay can be raised.

[0012]

[Example] Hereafter, the example of this invention is explained based on a drawing. The configuration of the 1st example of the planar mold electromagnetic relay built over the 1st invention at drawing 1 - drawing 4 is shown. In drawing, the electromagnetic relay 1 of this example has a three-tiered structure which carried out anode plate junction of the bottom which becomes the vertical side of the silicon substrate 2 which is a semi-conductor substrate, for example from borosilicate glass etc., respectively, the top as a bottom insulating substrate, and the bottom glass substrates 3 and 4. And opening 3a is prepared by ultrasonic machining etc. so that said top glass substrate 3 may open the movable-plate 5 upper-part part mentioned later. [0013] The plate-like movable plate 5 and the torsion bar springs 6 and 6 which support a movable plate 5 to revolve with the center position of this movable plate 5 rockable in the substrate vertical direction to a silicon substrate 2 are really formed in said silicon substrate 2 of anisotropic etching. Therefore, the movable plate 5 and the torsion bar spring 6 also consist of the same ingredient as a silicon substrate. As shown in drawing 3 , the flat-surface coil 7 which consists of a copper thin film which generates a field by energization is covered with the topface periphery section of said movable plate 5 with an insulating coat, and is prepared in it. Here, if there is joule heat loss and the big thin film coil of resistance is mounted in high density by resisted part, since driving force will be restricted by generation of heat, the coil has formed said flat-surface coil 7 with the electrocasting coil magnetization method by well-known electrolysis plating conventionally in this example. A electrocasting coil magnetization method forms a thin nickel layer by the spatter on a substrate, performs copper electrolysis plating, forms a copper layer on this nickel layer, it is removing a copper layer and a nickel layer except for the part equivalent to a coil, forms the flat-surface coil of the thin film which consists of a copper layer and a nickel layer, has the description which can mount a thin film coil in high density by low resistance, and is effective in a miniaturization and thin-shape-izing of a micro MAG device. Moreover, as shown in the both sides by the side of the inferior surface of tongue of a movable plate 5 at drawing 4 , the electric wiring 8 and 8 on a KO character is formed, and the traveling contacts 9 and 9, such as gold and platinum, are formed in each edge top face of each [ these ] electric wiring 8 and 8.

[0014] Furthermore, it is formed in the top face of the bottom glass substrate 4 by the pattern as electric wiring 10 and 10 shows with the two-dot chain line of <a href="mailto:drawing3">drawing3</a>, and the stationary contacts 11 and 11 which similarly consist of gold, platinum, etc. are formed in the location corresponding to said traveling contacts 9 and 9 of this electric wiring 10 and ten top faces. Said electric wiring 10 and 10 is pulled out through the through hole part prepared in the bottom glass substrate 4 at the inferior-surface-of-tongue side of the bottom glass substrate 4, as shown in <a href="mailto:drawing2">drawing2</a>.

[0015] The electrode terminals 12 and 12 of a pair electrically connected with the flat-surface coil 7 through the part of torsion bar springs 6 and 6 are formed in the side top face of the torsion bar springs 6 and 6 of a silicon substrate 2, and coincidence formation of these electrode terminals 12 and 12 is carried out with the flat-surface coil 7 by the electrocasting coil magnetization method on a silicon substrate 2. The permanent magnets 13A and 13B of the circle configuration which makes a field act on flat-surface coil 7 part of the opposite side of the movable plate 5 parallel to the shaft orientations of said torsion bar springs 6 and 6 and which makes a pair mutually, and 14A and 14B are prepared in the right-and-left-among drawing 1 side of a top and the bottom glass substrate 3. Mutually, while makes a pair, and it is prepared so that the bottom may serve as N pole and the bottom may serve as the south pole, and as every three permanent magnets 13A and 13B each are shown in drawing 2, every three permanent magnets 14A and 14B each of another side which makes a pair mutually are formed so that the bottom may serve as the south pole and the bottom may serve as N pole, as shown in drawing 2. [0016] Next, actuation is explained. For example, a current is passed in the flat-surface coil 7. using the electrode terminal 12 of + pole and another side as - pole for one electrode terminal 12. On both sides of a movable plate 5, by permanent magnet 13A, and 13B, 14A and 14B If the field is formed in the direction which crosses the flat-surface coil 7 along the flat surface of a movable plate 5 between up-and-down magnets as the arrow head of drawing 2 shows, and a current flows in the flat-surface coil 7 in this field According to the current density and flux density of the flat-surface coil 7, magnetic force F acts in the flat-surface coil 7 and the direction (shown in drawing 5) which in other words followed the left-hand rule of Fleming of a current, flux density, and the force to the both ends of a movable plate 5, and this force is searched for from the Lorentz force.

[0017] This magnetic force F will be called for by the following (1) formula, if flux density according the current density which flows in the flat-surface coil 7 to i, permanent magnets 13A and 13B, and 14B is set to B.

F=ixB...(1)

It changes in fact with coil length w (shown in <u>drawing 5</u>) which the number of turns n and magnetic force F of the flat-surface coil 7 commit, and becomes like the following (2) types. [0018] F=nw (ixB) ... (2)

On the other hand, when a movable plate 5 rotates, torsion bar springs 6 and 6 are twisted and the relation of the displacement angle phi of spring reaction force F' of the torsion bar springs 6 and 6 generated by this and a movable plate 5 becomes like the following (3) types. phi=(Mx/GIp)=(F'L/8.5 x109 r4) x11 ... (3) Here, it is Mx. It twists and the moment and G are modulus of transverse elasticity and Ip. It is a pole second moment of area. Moreover, L, I1, and r are the distance from the medial axis of a torsion bar spring to a power point, the die length of a torsion bar spring, and the radius of a torsion bar spring, and are shown in drawing 5, respectively.

[0019] And a movable plate 5 rotates to the location where said magnetic force F and spring reaction force F' balance. Therefore, by substituting F of (2) types for F' of (3) types shows that the displacement angle phi of a movable plate 5 is proportional to the current i which flows in the flat-surface coil 7. Therefore, if sufficient current for the traveling contacts 9 and 9 of movable-plate 5 inferior surface of tongue to overcome the spring force of a torsion bar spring 6, and carry out a pressure welding to the stationary contacts 11 and 11 of bottom glass substrate 4 top face is passed in the flat-surface coil 7, traveling contacts 9 and 9 and stationary contacts 11 and 11 can be contacted by rotation of a movable plate 5. And a switch of a contact, or energization/cutoff of a current is controllable by carrying out ON/OFF of the switch or current

of the direction of a current passed in the flat-surface coil 7.

[0020] Next, the count result of the flux density distribution by the permanent magnet in the electromagnetic relay of this example is explained. <u>Drawing 6</u> showed the flux density distribution computation model of the permanent magnet of the shape of a cylinder used for this example, and calculated the magnetic flux of the point of dividing and asking the minute field dy for the front face of N pole of a permanent magnet, and each south pole.

[0021] If flux density formed on Bn and a south pole front face in the flux density formed on N pole front face is set to Bs, the flux density [ in / it can ask for these by \*\*(4) of [several 1] and [several 2] and (5) equations from the formula of the flux density distribution by the cylinder–like permanent magnet, and / the point of arbitration ] B is Bn. Bs It becomes the compound thing and is shown by (6) equations.

[0022]

[Equation 1]
$$Bn = \frac{Br}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{z [(d/2)^2 - y^2]^{1/2} dy}{[(y-y_0)^2 + z^2][(d/2)^2 + z^2 + y_0^2 - 2y_0y]^{1/2}}$$

[0023]

[Equation 2] Bs =

$$\frac{Br}{2\pi} \int_{-a/2}^{a/2} \frac{(z+1)[(d/2)^2 - y^2]^{1/2} dy}{[(y-y_0)^2 + (z+1)^2][(d/2)^2 + (z+1)^2 + y_0^2 - 2y_0y]^{1/2}}$$

[0024] B=Bn+Bs ... (6)

Here, it sets at each ceremony of [several 1] and [several 2], and is Br. The distance of the Npole face of a permanent magnet and an S-pole face and d of the coordinate and I to which the residual magnetic flux density of a permanent magnet, x, and y and z express the point of the arbitration of the surrounding space of a permanent magnet are the radii of each pole face. For example, the radius of 1mm, height of 1mm, the Sm-Co permanent magnet DIANET of residual magnetic flux density 0.85T The result of having calculated flux density distribution of the field a perpendicular to the front face of the permanent magnet arranged as shown in drawing 7 is shown in drawing 8 using DM-18 (a trade name, product made from the SEIKO electronic parts). [0025] When it has arranged like drawing 7, the space between magnets serves as flux density more than abbreviation 0.3 T. Next, the count result of the amount of displacement of a movable plate 5 is explained. Width of face of the flat-surface coil 7 formed in a movable plate 5 was set to 100 micrometers, thickness of 14 and a movable plate 5 was set to 20 micrometers for number of turns, and the radius of a torsion bar spring 6 was searched for from (2) types and (3) types, having used die length as 5mm for 25 micrometers and die length having used width of face of 1mm and a movable plate 5 as 4mm. In addition, 0.3 T obtained by the above-mentioned flux density distribution count was used for flux density.

[0026] Consequently, (A) and the (B) Fig. of <u>drawing 9</u> show that the displacement angle of 2 times is acquired by current 1.5 mA. In addition, (C) shows the relation between a current and the heating value Q to generate, and the generating heating value per unit area at this time is 2 13 microwatts/cm. It became. Next, calorific value and the relation of heat dissipation are explained. Calorific value is the Joule's heat generated in resistance of a coil, therefore the heating value Q generated in per unit time amount is expressed by the following (7) types. [0027] Q=i2 R ... (7)

Here, the current and R to which i flows in a coil are resistance of a coil. Heat release Qc by the calorific value convection current It is expressed with the following (8) types. Qc =hSdeltaT ... (8)

Here, h is [ the surface area of a component and deltaT of a heat transfer coefficient (air is  $5\times10-3$  to  $5\times10-2$  [watt /cm2 \*\*]) and S ] the temperature gradients of a component front face

and air.

[0028] (8) types are Qc =1.0 when area of the movable plate used as the exoergic section is set to 2 (4x5) 20mm. deltaT [m W/(degree C)] ... It becomes (8) ' and is 2 dozens of microwatts/cm. If it is the calorific value of extent, it turns out that the problem of the temperature rise of a component can be disregarded. In addition, heat release Qr according to radiation to reference It is expressed with the following (9) types.

[0029] Qr =epsilonSsigmaT-four ... (9)

Here, for epsilon, emissivity (epsilon=1D generally [ blackbody ] epsilon< 1) and S are [ a Stefan-Boltzmann constant (pi2k4/60h3c2) and T of the surface area of a component and sigma ] the skin temperature of a component. Moreover, heat release Qa by the conduction from a torsion bar spring It is expressed with the following (10) types. [00:30]

Qa =2lambda(S/I1) deltaT ... (10)

Here, lambda is the heat conductivity (silicon is 84W / mK), and S is the cross-sectional area of a torsion bar spring, and I1. The die length of a torsion bar spring and deltaT are the temperature gradients of the both ends of a torsion bar spring, (10) types are Qa =0.1, when the radius of a torsion bar spring is set to 25 micrometers and die length is set to 1mm. deltaT [m W/(degree C)] ... It becomes (10) '.

[0031] Next, bending by the movable-plate self-weight of a torsion bar spring and bending of the movable plate by electromagnetic force are explained. These computation models are shown in drawing 10. It is [ die length / of a torsion bar spring / width of face / of I1 and a torsion bar spring / weight / of b and a movable plate ] the die length of W and a movable plate about the width of face of t and a movable plate in the thickness of f and a movable plate L1 If it carries out, amount of bending deltay of a torsion bar spring will become like the following (11) types using the count approach of the amount of bending of a cantilever.

[0032]

deltaY= (1/2) (4l.13 f/Ebt3) ... (11)

Here, E is the Young's modulus of silicon. Moreover, weight f of a movable plate is expressed with the following (12) types.

f=WL1 trhog ... (12)

Here, rho is the volume density of a movable plate and g is gravitational acceleration. [0033] Moreover, similarly amount of bending deltaX of a movable plate becomes like the following (13) types using the count approach of the amount of bending of a cantilever. deltaX=4(L1/2) 3 F/EWt3...(13)

Here, F is magnetic force which acts on the edge of a movable plate. And it considers that the coil length w of (2) types is die-length [ of a movable plate ] W, and said magnetic force F asks for it.

[0034] The count result of the amount of bending of these torsion bar springs and the amount of bending of a movable plate is shown in [Table 1]. In addition, the amount of bending of a movable plate calculates magnetic force F as 30microN.

[0035] [Table 1]

トーションバーと可動板の挽み量の計算結果

W	6 mm	6 mm	6 mm					
Lı	13mm	13mm	13mm					
t	50 μ m	50 μ m	100 μ m					
b	50 μ m	50 μ m	50 μ m					
1,	0.5mm	1.0mm	1.0mm					
f	89 µ N	89 µ N	178 µ N					
ΔΥ	0.022 μ m	0. 178 μ m	0. 356 μ m					
ΔΧ	0.125 μ m	0. 125 μ m	0.016μm					

[0036] Amount of bending deltaY according to a movable plate with width of face of 6mm, a die length [ of 13mm ], and a thickness of 50 micrometers the case of the torsion bar spring of width of face of 50 micrometers and die-length 1.0 mm so that clearly from the above-mentioned [table 1] is 0.178. It is mum and amount of bending deltaY is 0.356 also considering the thickness of a movable plate as double 100 micrometers. It is mum. Moreover, amount of bending deltaX according to magnetic force the case of a movable plate with width of face of 6mm, a die length [ of 13mm ], and a thickness of 50 micrometers is 0.125. It is mum and is uninfluential in the property of about 200 micrometers, then the electromagnetic relay of this example in any way in the amount of displacement of movable-plate both ends.

[0037] As explained above, in the electromagnetic relay of this example, the effect by generation of heat of a coil can also be disregarded, and a problem does not have the rocking property of a movable plate 5 in any way, either, and the same function as usual can be demonstrated, and by forming contact moving part, a coil, etc. using the manufacture process of a semiconductor device, compared with the former, it can be markedly alike, and can consider as a micro thin electromagnetic relay. For this reason, the miniaturization of the control–system system which controls the output of the last stage by the electromagnetic relay can be attained. Moreover, mass production method becomes possible by manufacturing in the manufacture process of a semiconductor device.

[0038] Next, the production process of the electromagnetic relay of the 1st example of the above is explained, referring to <u>drawing 11</u> – <u>drawing 14</u>. First, the processing process of a silicon substrate is shown in <u>drawing 11</u> and <u>drawing 12</u>. Thickness 300 Silicon substrate 101 of mum A vertical side is oxidized thermally and an oxide film (1 micrometer) 102 is formed (a process).

[0039] Next, the pattern of a through hole is formed in a rear-face side with a HOTORISO graph, etching removal of the oxide film of a through hole part is carried out (b process), and it is thickness 0.5 about the oxide film of the movable-plate formation section further. It removes to mum (process c). Next, it is the wax layer 103 to a front-face side. It is anisotropic etching to the through hole part after preparing 100 mum Carry out (process d).

[0040] The thin oxide film for movable Itabe by the side of a rear face is removed (process e), and it is anisotropic etching to a part for a through hole and movable Itabe 100 mum Carry out (process f). Next, the mask of the electric wiring part is left and carried out to the silicon substrate part equivalent to the movable-plate rear face surrounded in the through hole part, for example, the spatter of nickel or copper is performed, the U-shaped electric wiring 8 and 8 is formed, a mask is further carried out except for a traveling contact part, the layer of gold or platinum is formed by vacuum evaporationo etc., and traveling contacts 9 and 9 are formed (process g).

[0041] Next, wax layer 103 by the side of a front face It removes and is the oxide film 102 by the side of a front face. Upwards, a flat-surface coil and an electrode terminal area (not shown) are conventionally formed with a well-known electrocasting coil magnetization method. A electrocasting coil magnetization method is a silicon substrate 101. The spatter of nickel is performed, a nickel layer is formed, copper electrolysis plating is performed, and a copper layer is formed in a front-face side. Next, the copper layer which carries out the mask of the part which is equivalent to a flat-surface coil and an electrode terminal by the resist of a positive type. performs copper etching and nickel etching one by one, removes a resist after etching, performs copper electrolysis plating further, covers the perimeter of a nickel layer with copper, and is equivalent to a flat-surface coil and an electrode terminal is formed. Next, after applying the plating resist of a negative mold to the part except a copper layer, copper electrolysis plating is performed, a copper layer is thickened, and a flat-surface coil and an electrode terminal are formed. And a flat-surface coil part is covered by insulating layers, such as for example, photosensitive polyimide. What is necessary is just to carry out by repeating the process from the spatter process of nickel to the insulating stratification again, when making a flat-surface coil two-layer (process h).

[0042] Next, it is anisotropic etching to the through hole part after preparing wax layer 103 ' in a

front-face side and carrying out the mask of the part for a movable-plate flesh-side surface part 100 mum Carry out, a through hole part is made to penetrate, and wax layer 103 is removed except for a part for movable Itabe. In this case, up-and-down oxide film 102 It removes. Thereby, a movable plate 5 and a torsion bar spring (not shown) are formed, and the silicon substrate 2 of drawing 1 is formed (processes i and i).

[0043] Above, the movable plate 5 and torsion bar spring of a silicon substrate 2 are formed in one. Then, what is necessary is to combine the top glass substrate 3 and the bottom glass substrate 4 with the vertical side of a silicon substrate 2 by anode plate junction, respectively, and just to attach permanent magnets 10A and 10B, and 11A and 11B in the predetermined location of the up-and-down glass substrates 3 and 4, after removing the wax layer for movable leads

[0044] Next, the processing process of a vertical glass substrate is explained, referring to drawing 13 and drawing 14. First, the top glass substrate 3 makes a hole in the location which is equivalent to a movable-plate upper part part with ultrasonic machining, and should just form opening 3a (process a). On the other hand, in the bottom glass substrate 4, the through holes 4a and 4a for through holes are first formed from the rear-face side of a glass substrate 4 by the electrolysis electron discharge method (process b).

[0045] And the spatter of nickel or copper is carried out to both sides of the bottom glass substrate 4, and it is the metal layer 104. It forms (process c). Next, the mask of the electric wiring part containing through hole 4a is carried out, other parts are etched, and it is the metal layer 104. Electric wiring 10 and 10 is formed by removing (process d). Next, the pattern of a stationary contact is formed in the front-face side of a glass substrate 4 with a HOTORISO graph for lift off, a fixed contact surface is removed, and it is a resist 105. It applies (process e). [0046] Next, it is the vacuum evaporationo layer 106 by vacuum evaporationo of gold or platinum to the whole surface by the side of glass substrate 4 front face. It forms (process f). Next, vacuum evaporationo layer 106 of other parts excluding a fixed contact surface by removing a resist It removes and stationary contacts 11 and 11 are formed (process g). Next, the 2nd example of the electromagnetic relay concerning the 1st invention is shown in drawing 15. In addition, the same sign is given to the same element as the 1st example, and explanation is omitted.

[0047] In drawing, although the configuration of a silicon substrate 2 and the bottom glass substrate 4 of the electromagnetic relay 21 of this example is the same as that of the 1st example, the configurations of top glass substrate 3' differ. That is, top glass substrate 3' is considered as the configuration which blockades the part equivalent to opening 3a of the top glass substrate 3 of the 1st example as slot 3A' by an electron discharge method etc. And top glass substrate 3' and the bottom glass substrate 4 are combined with the vertical side of a silicon substrate 2 by anode plate junction, and it is considering as the configuration which seals the rocking space of a movable plate 5. Furthermore, this closed space is made into a vacuum ambient atmosphere, and an electromagnetic relay 21 is made to drive.

[0048] Since the air resistance at the time of a movable plate 5 rotating is lost according to this configuration, the responsibility of a movable plate can be improved. and — although there is a possibility that gas may trespass upon the rocking space of a movable plate when adhesives are used in case up—and—down glass substrate 3' and 4 are combined with a silicon substrate 2— this example — like — If anode plate junction is used, the worries will not exist. Moreover, in case the vacuum lock of the rocking space of a movable plate 5 is carried out, withstand voltage improves by enclosing a sulfuration fluorine (SF6) in space.

[0049] Next, the example of the electromagnetic relay concerning the 2nd invention is shown in drawing 16, and it explains to it. In addition, the same sign is given to the same element as each above—mentioned example, and explanation is omitted. In drawing 16, by the electromagnetic relay 31 of this example, it replaces with a flat-surface coil and the permanent magnet 32 of a thin film is formed in a movable-plate 5 side. The flat-surface coils 7A and 7B which generate a field by energization on the other hand into the part of the opposite side side of a movable plate 5 parallel to the shaft orientations of the torsion bar springs 6 and 6 of a silicon substrate 2 are formed. Moreover, top glass substrate 3' is the configuration which is the same as that of what is

shown in <u>drawing 15</u>, has slot 3A', and was blockaded. In addition, although the permanent magnet was prepared in the shape of a frame in this example, you may make it prepare a permanent magnet only in a flat-surface coil and the corresponding side.

[0050] Even if it forms the permanent magnet 32 of a thin film in a movable-plate 5 side and forms the flat-surface coils 7A and 7B in a silicon substrate 2 side like this configuration, it can be made to operate like each above-mentioned example. Furthermore, since the coil is not prepared in a movable-plate 5 side, the problem about generation of heat is not produced. Moreover, since the magnet of a thin film is used, it does not say that actuation of a movable plate 5 becomes blunt, and the closure of only a movable plate 5 is also possible. And if the vacuum lock of the rocking space of a movable plate 5 is carried out, it will be the same as that of the example shown in <u>drawing 15</u>, and the responsibility of a movable plate 5 will become good.

[0051]

[Effect of the Invention] the electromagnetic relay using the conventional coil mold coil since it considered as the configuration which forms a coil using the conventional not a coil mold but semiconductor device manufacturing technology according to this invention as explained above – comparing – markedly – alike – a miniaturization – and it can thin-shape-ize. Therefore, integration and the miniaturization of the system of a control system which use an electromagnetic relay can be attained.

[0052] Moreover, the configuration which makes rocking space of a movable plate a closed space, and carries out a vacuum lock, then air resistance can be abolished, the responsibility of a movable plate can be improved, and relay responsibility can be raised.

### [Translation done.]

### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] The block diagram showing the 1st example of the electromagnetic relay concerning the 1st this invention

[<u>Drawing 2</u>] The enlarged vertical longitudinal sectional view of the 1st example of the same as the above

[Drawing 3] The expansion perspective view by the side of the top face of the movable plate of the 1st example of the same as the above

[<u>Drawing 4</u>] The expansion perspective view by the side of the inferior surface of tongue of the movable plate of the 1st example of the same as the above

[Drawing 5] Drawing explaining the principle of operation of the galvanomirror of the 1st example of the same as the above

[Drawing 6] The computation model Fig. of the flux density distribution by the permanent magnet of the 1st example of the same as the above

[Drawing 7] Drawing showing the calculated flux density distribution location

[Drawing 8] Drawing showing the count result of flux density distribution of the location shown in

### drawing 7

[<u>Drawing 9</u>] The graph which shows the count result of the amount of displacement of a movable plate, and the amount of currents

[Drawing 10] A torsion bar spring and the computation model Fig. of the amount of bending of a movable plate

[Drawing 11] The explanatory view of the processing process of the silicon substrate of the 1st example of the same as the above

[Drawing 12] The explanatory view of the processing process of the silicon substrate following drawing 11

[Drawing 13] The explanatory view of the processing process of the glass substrate of the 1st example of the same as the above

[Drawing 14] The explanatory view of the processing process of the glass substrate following drawing 13

[Drawing 15] The perspective view showing the configuration of the 2nd example of the electromagnetic relay concerning the 1st invention

[Drawing 16] The perspective view showing the configuration of the example of the electromagnetic relay concerning the 2nd invention

[Description of Notations]

- 1, 21, 31 Electromagnetic relay
- 2 Silicon Substrate
- 3 3' Top glass substrate
- 4 Bottom Glass Substrate
- 5 Movable Plate
- 6 Torsion Bar Spring
- 7 Flat-Surface Coil
- 9 Traveling Contact
- 11 Stationary Contact
- 13A, 13B, 14A, 14B, 32 Permanent magnet

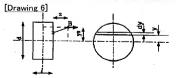
### [Translation done.]

### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

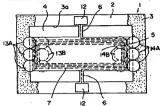
### DRAWINGS

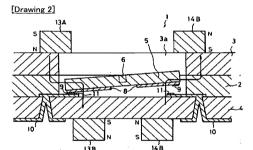


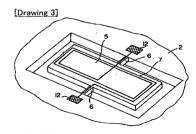
[Drawing 7]



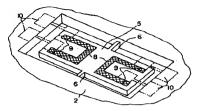
# [Drawing 1]



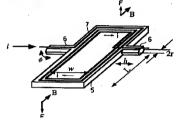




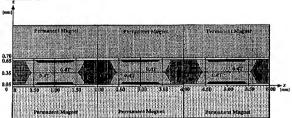
[Drawing 4]



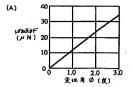
[Drawing 5]

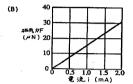


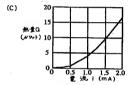


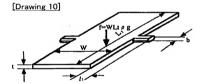


[Drawing 9]

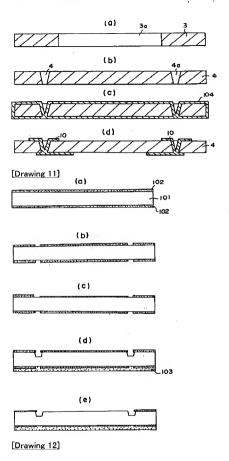


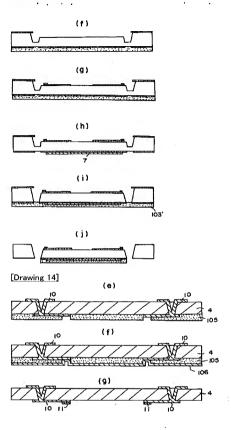




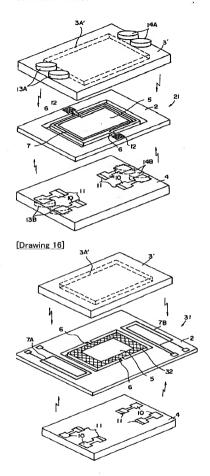


[Drawing 13]





[Drawing 15]



[Translation done.]